

テラヘルツ光サンプリング解析システム TAS7400TS / TAS7500TS 向け 入射角可変光学セット SHT-710232

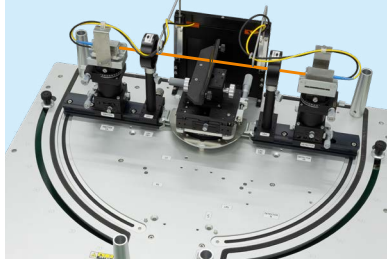
透過 / 反射測定例

試料

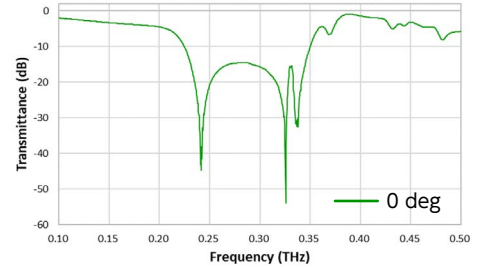


Jバンド用周波数選択板 (FSS)

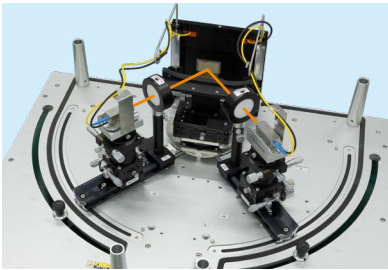
透過測定



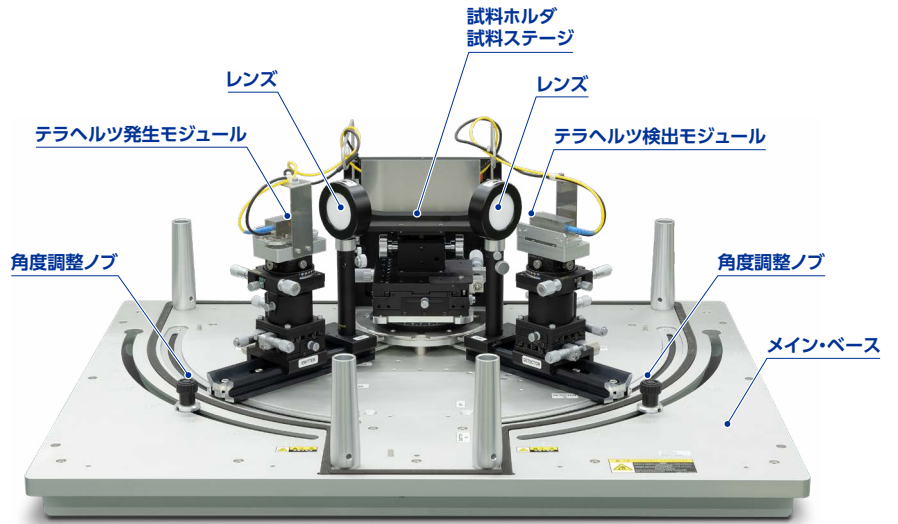
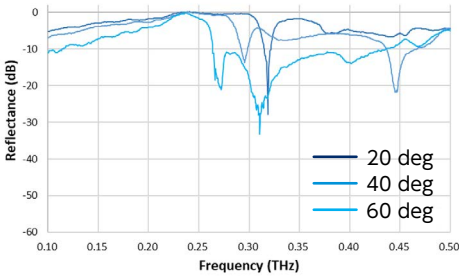
透過率



反射測定 (入射角可変)



反射率 (20° / 40° / 60°)



システム構成例 (30GHz~2THz)

TAS7400TS基本構成



発生モジュール TAS1120 検出モジュール TAS1220

タイムドメイン測定
周波数測定



SHT-210067 (透過モジュール)
+
SHT-710068 (分光測定ベース)



SHT-710232 (入射角可変光学セット)

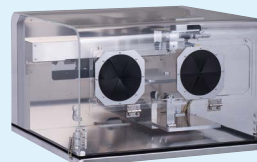


SHT-210068 (反射モジュール)
+
SHT-710068 (分光測定ベース)

透過測定

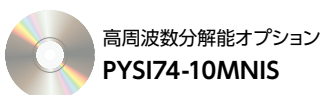
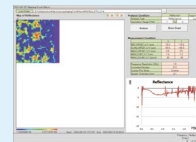
反射測定

マッピング測定



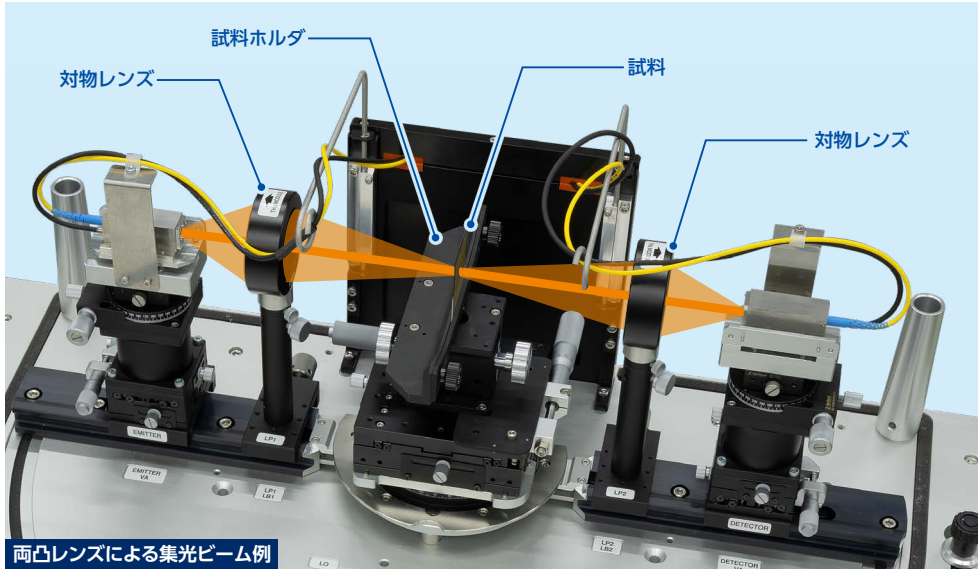
SHT-710122X04 (分光イメージング光学セット)
PYSI74-08MNIS (Automatic Control Measuring Option)

Automatic Control Measuring Option



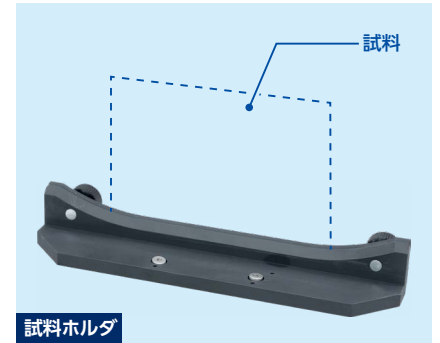
高周波数分解能オプション
PYSI74-10MNIS

光学配置



両凸レンズから平凸レンズ(いずれも付属品)に交換することで集光ビームから平行ビームに切り替え可能。

(透過および入射角可変反射測定時)

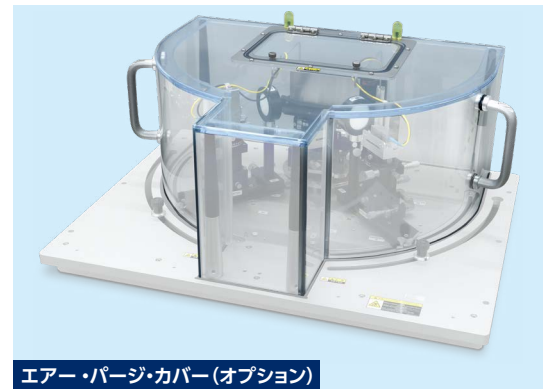


両凸レンズによる集光ビーム例

試料ホルダ

製品仕様

項目	仕様
入射角(反射角)可変範囲	20°~90° 連続可変
測定試料サイズ	板状試料 厚さ1mm~10mm 最大100mm(H) × 150mm(W)
測定光学配置	透過/反射/垂直入射(0°)
ビーム形状	平行ビーム/集光ビーム ※レンズ交換により可能
搭載可能テラヘルツモジュール	発生: TAS1120(~2THz)、TAS1110(~4THz) 検出: TAS1220(~2THz)、TAS1230(~7THz)
偏光	P偏光/S偏光 ※テラヘルツモジュールの配置変更により可能
寸法	820mm(W) × 630mm(D) × 350mm(H)
重量	64kg以下



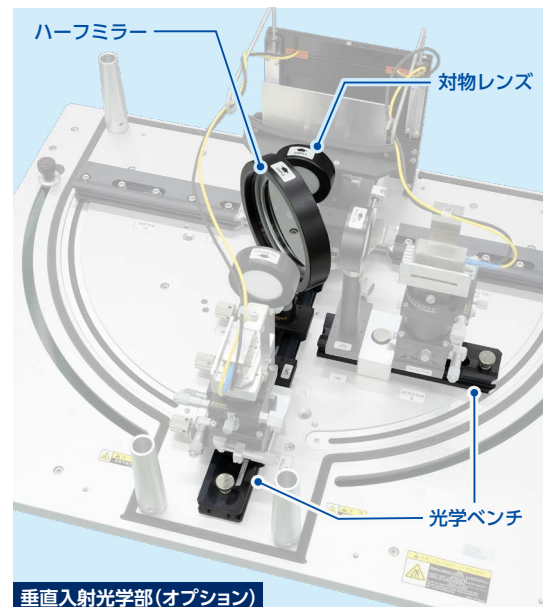
エア・パージ・カバー(オプション)

オプション仕様

項目	型番	仕様
エア・パージ・カバー	SHT-710239	外形: 690mm(W) × 608mm(D) × 290mm(H)
垂直入射光学部	SHT-710233	構成: ハーフミラー、対物レンズ、光学ベンチ
試料ホルダセット	SHT-710240	試料ホルダ1: 開口サイズ: 20mm 形状: 円形
		試料ホルダ2: 開口サイズ: 20mm × 40mm 形状: 長穴
		試料ホルダ3: 開口サイズ: 20mm × 80mm 形状: 長穴



試料ホルダセット(オプション)



垂直入射光学部(オプション)

● 製品仕様および外観等は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

ADVANTEST®

<https://www.advantest.com/>

株式会社アドバンテスト

本社事務所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-6-2 新丸の内センタービルディング
TEL: 03-3214-7500(代)

● お問い合わせ: 新事業推進室

E-mail: info_t@advantest.com



詳しくはWebへ